Photor sist compositions containing t-substitut d organom thyl vinylaryl ether materials	
Patent Number:	□ <u>US4603101</u>
Publication date:	1986-07-29
Inventor(s):	CRIVELLO JAMES V (US)
Applicant(s):	GEN ELECTRIC (US)
Requested Patent:	☐ <u>JP62115440</u>
Application Number:	US19850780768 19850927
Priority Number(s):	US19850780768 19850927
IPC Classification:	G03C1/76
EC Classification:	C08F12/22, G03F7/038, G03F7/039
Equivalents:	☐ <u>DE3620677</u> , ☐ <u>FR2588099</u> , ☐ <u>GB2180837</u> , JP1869210C, JP5069420B
Abstract	
t-Butylvinylaryl ethers are provided which can be used to make t-butyl substituted polyaryl ethers and photoresist compositions. The photoresist compositions can be made by combining the t-butylpolyaryl ethers with aromatic onium salts.	
Data supplied from the esp@cenet database - I2	

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 115440

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和62年(1987)5月27日

G 03 C C 08 L G 03 C

LEK 3 1 1

8205-2H 7602-4J 7267-2H 審査請求 未請求 発明の数 3 (全7頁)

図発明の名称

ホトレジスト組成物および t -置換オルガノメチルビニルアリール エーテル材料

> ②特 願 昭61-223978

29出 願 昭61(1986)9月24日

優先権主張

砂1985年9月27日

少計

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

②発 明

ジエームズ・ビンセン

アメリカ合衆国、ニューヨーク州、クリフトン・パーク、

カールトン・ロード、756番 ト・クリベロ

②出

ゼネラル・エレクトリ

アメリカ合衆国、12305、ニユーヨーク州、スケネクタデ

ツク・カンパニイ イ、リバーロード、1番

②代 理 人 弁理士 生沼 徳二

1. 発明の名称

ホトレジスト組成物およびt-罹換オルガノ メチルピニルアリールエーテル材料

2. 特許請求の範囲

· 1. (A)本質的に次式:

[式中のRはC₍₁₋₈₎ アルキル基およびC₍₆₋₁₄₎ アリール基よりなる群から選ばれる一個の基で、 R! およびR² は同じか異なる一価のC₍₁₋₈₎ ア ルキル基で、R³は水業およびC₍₁₋₃₎ アルキル から選ばれる一個の基で、R 4 は水素、C (1-3) アルキルおよびこれらの組合せから選ばれる一価

の基でR⁵ は同じか異なるC ₍₁₋₈₎ アルキル基、 CI、Br、NO2 、CN、C (1-8) アルコキシおよび C₍₁₋₈₎ アルキルエステルから遊ばれ、ad0‐ 2 に等しい] の化学結合単位よりなるポリスチレ

- (B) 有効量のカチオン性光開始剤および
- (C) 成分(A) 1部当り10-95部の

を含むホトレジスト組成物。

不活性有機溶剤

- 2. 重合体が化学結合した4-t-プトキシス チレン単位よりなる特許請求の範囲第1項記載の ホトレジスト組成物。
- 3. 取合体が化学結合した4-t-ブトキシー αーメチルスチレン単位よりなる特許請求の範囲 第1項記載のホトレジスト組成物。
- 4. 光開始剤としてジアリールヨードニウム塩 を用いる特許請求の範囲第1項記載のホトレジス 卜組成物。
- 5. 光開始剤としてトリアリールスルホニウム 塩を用いる特許請求の範囲第1項記載のホトレジ

スト組成物。

6. 次式:

[式中のRは $C_{(1-8)}$ アルキル基および $C_{(8-14)}$ アリール基よりなる群から選ばれる一価の基で、 R^1 および R^2 は間じか異なる一価の $C_{(1-8)}$ アルキル から選ばれる一価の基で、 R^4 は水素および $C_{(1-3)}$ アルキル から選ばれる一価の基で、 R^4 は水素、 $C_{(1-3)}$ アルキルおよびこれらの組合せから選ばれる一価の基で R^5 は同じか異なる $C_{(1-8)}$ アルキル 基、CI、Br、 NO_2 、CN、 $C_{(1-8)}$ アルコキシおよび $C_{(1-8)}$ アルキルエステルから選ばれ、aは0-2に等しい C0 のアルケニルアリールエーテル。

ルキル基で、 R^3 は水素および $C_{(1-3)}$ アルキルから選ばれる一価の基で、 R^4 は水楽、 $C_{(1-8)}$ アルキルおよびこれらの組合せから選ばれる一価の基で R^5 は同じか異なる $C_{(1-8)}$ アルキル基、C (R) アルキル基、C (R) アルキルエステルから選ばれ、R は R (R) の化学結合単位よりなる重合体。R 3 . 発明の詳細な説明

発明の背景

種々の感光性重合体を粗々の光増感剤と組合せて用いて、紫外線照射時に重合体に架橋を起すことが行われており、このような重合体の例として、メリル(Morrill)が米国特許第2、948、610号でアジド函合体を開示し、またミンスク(Minsk)が米国特許第2、725、372号でポリビニルアルコールの不飽和エステルを開示し、これらはそれぞれイーストマン・コダック社(Eastman Kodak)のホトレジストKPRおよびKMERである。

イトウらの米国特許第4, 491, 628号に、

7. 4-1-ブトキシスチレンである特許請求の範囲第6項記載のアルケニルアリールエーテル。
 8. 4-t-ブトキシーα-メチルスチレンである特許請求の範囲第6項記載のアルケニルアリールエーテル。

9.3-t-ブトキシスチレンである特許請求 の範囲第6項記載のアルケニルアリールエーテル。 10.本質的に次式:

【式中のRは $C_{(1-8)}$ アルキル基および $C_{(8-14)}$ アリール基よりなる群から選ばれる一価の基で、 R^1 および R^2 は同じか異なる一価の $C_{(1-8)}$ ア

t - ブチルエステルや t - ブチルカーボネートな どの反復側基を有するポリスチレンのような重合 体を光開始剤と組合せて用いることが開示されて いる。紫外線に暴躍すると酸が発生し、これがス チリルt-ブチルエステルまたはスチリルt-ブ チルカーポネートを対応する塩基可溶性フェノー ルに転化する。増感剤の波長を変える増感剤をこ のホトレジストに加えることもできる。イトウら のボジまたはネガ型ホトレジスト組成物は従来の ホトレジストより著しく有利であるが、ポリーt - ブトキシカルポニルオキシスチレンまたは対応 するポリーヒープトキシカルポニルオキシーαー メチルスチレンを紫外線に暴蕗すると、二酸化炭 紫およびイソプチレンの両方、すなわち過剰量の 気体状副生物が生成する。塩基水溶液に可溶な生 成物またはn-ヘキサンと塩化メチレンの混合物 に可溶な生成物に転化でき、しかも過剰量の気体 状副生物を発生しない、重合体材料を用いたポジ またはネガ型ホトレジスト組成物が得られれば望 ましい。

本発明は、次式:

【式中のRは $C_{(1-8)}$ アルキル基および $C_{(6-14)}$ アリール基よりなる群から選ばれる一価の基で、 R^1 および R^2 は同じか異なる一価の $C_{(1-8)}$ アルキル基で、 R^3 は水業および $C_{(1-3)}$ アルキルから選ばれる一価の基で、 R^4 は水紫、 $C_{(1-3)}$ アルキルおよびこれらの組合せから選ばれる一価の基で R^5 は同じか異なる $C_{(1-8)}$ アルキル甚、C(1-8) アルキルエステルから選ばれ、1-1 1

本発明によれば、

(A) 本質的に次式:

【式中のR、R¹、R²、R⁴、R⁴およびR⁵およびaは前記定義の通り】の化学結合単位よりなるポリスチレン、

- (B) 有効量のカチオン性光開始剤、および
- (C) 成分(A) 1 部当り10-95部の不活性有機溶剤

を含むホトレジスト組成物が提供される。

R、R¹、R² およびR³ に含まれる一価のア ルキル基は、例えば、メチル、エチル、プロピル、 ブチル、ペンチル、ヘキシルであり、R³ および ルエーテルが重合でき、得られる重合体が育効量のアリールオニウム塩(後述)と組み合わせるとホトレジストとして使用できることを見出してなしたものである。こうして得られるホトレジストは、次式:

[式中の R¹、 R⁴、 R⁵ および a は前記定義の 通り]の化学結合単位を多数有するポジ型ホトレ ジストに転化することができる。本質的に式 (2) の化学結合単位よりなる塩基可溶性重合体を生成 する結果として、有利なことには、イソプチレン のような不飽和オレフィンが生成し、イトウらの ホトレジスト法で生じる二酸化炭素のような気体 状副生物を余分に発生することはない。

発明の概要

R⁴ に含まれる一価の基は、例えば、水楽または Rに含まれるC₍₁₋₃₎ アルキルである。そのほか にRはフェニル、トリル、キシリルまたはこれら の置換されたものとなり得、一方R⁵ はメトキシ、 エトキシ、カルベトキシなどとなり得る。

本発明の実施にあたって使用できるカチオン性 光明始剤は、例えばジアリールヨードニウム塩で あり、具体例には下記のものがある。

アリールスルホニウム塩も含まれ、その具体例に は下記のものがある。

本発明の実施にあたって使用できる別のカチオン性光別始剤は、例えば次のものである。

$$(CH, -\langle O \rangle \rightarrow S^* A \times F_6^-$$

特開昭62-115440(5)

光開始剤の有効量は、前述した成分(A)、(B) および (C) のホトレジスト組成物の全重量に基づいて 0.5-20 重量%の光開始剤である。

式 (1) に含まれる t - ブチルピニルアリール エーテルの具体例には次のものがある。

式 (1) の t - ブチルビニルアリールエーテル を本質的に式 (3) の化学結合単位よりなる重合 体に重合させるには、有効量の重合触媒、例えば 過酸化ベンソイル、2.2′ーアソピスイソブチ ロニトリル、過酸化ラウロイル、過酸化ジクミル、 tープチルベルオキシピバレート、過酸化プロピ オニルなどを用いて重合を行うことができる。重 合触媒の有効量は、触媒と式(1)の範囲内の t - プチルピニルアリールエーテルとの重量に基づ いて 0. 1-5 重量%の触媒である。式 (1) の t-ブチルビニルアリールエーテルの重合は、窒 素や貴ガスのような不活性雰囲気中で、不活性有 機溶剤の存在下、25℃-180℃の範囲の温度 で行うことができる。不活性有機溶剤としては、 例えばベンゼン、トルエン、水、エタノール、シ クロヘキサン、キシレン、クロロベンゼン、ジメ チルホルムアミド、イソプロピルアルコールなど が適当である。

本質的に式(3)の化学結合単位よりなる本発明のホトレジスト組成物と組合せて用い得る不活

式 (1) の t - プチルアリールピニルエーテル を製造する好適な方法は、例えば次の通りである。

性有機溶剤としては、例えば、1.2ージメトキシエタン、セロソルブアセテート、シクロヘキサノン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、クロロベンゼン、ジエチレングリコールジメチルエーテル、塩化メチレン、1,2ージクロロエタン、ジオキサンなどが適当である。

特定の災能態様では、増感剤を本質的に式(3)の化学結合単位よりなるホトレジストの思想を設して、地でである。これらの地感剤は、な野的に式(3)の化学結合単位よりなるますの地域がある。これらの地域がある。これらの地域ができる。これらの地域ができる。これらの地域ができる。これらの地域ができる。これらの地域ができる。これらの地域ができる。これらの地域ができる。これらの地域ができる。これらの地域ができる。これらの地域ができる。これらの地域ができる。これらの地域ができる。これらの地域ができる。というサーンには、アクリジンオレン、イン・フラーン、アントラセン、ラーン・ファントラーン、デントロン、チオキサントンがある。

本発明のホトレジスト組成物では、波長227 - 600 nm (ナノメータ) の紫外線を用いた場合に、良好な結果が得られることを確かめた。しかし、場合によっては、電子ピームやX線も使用できる。ネガ型ホトレジストが望ましい場合には、ホトレジストを適当な支持体に標準のスピンキャスト法で塗布し、照射して酸触媒を遊離させた後、希塩基水溶液の代りに有機溶剤の混合液、例えば n - ヘキサンと塩化メチレンを用いることができる。

当業者が本発明をうまく実施できるように、以 下に実施例を限定としてではなく例示として説明 する。部はすべて筆量基準である。

実施例1

窒素雰囲気下で激しくかきまぜなから、62.9g(0.34モル)の4ークロロスチレンおよび250回の乾燥蒸留テトラヒドロフランを8.9g(0.37モル)のマグネシウム金属切り腐に、十分なテトラヒドロフランで切り扇をおおうようにして、滴加した。発熱反応を外部冷却によ

物の構造と一致していた。

元素分析

計算値 (C₁₂H₁₆O) C81.82%; H9.09% 実制値 C81.64%; H8.89%

0.03 gの2.2′ーアソビスイソブチロニトリルを5 gの上記4ーtープトキシスチレンに溶解した溶液を、窒素でパージした後、容器に関則した。混合液を密封条件下で70℃に18時間加熱した。固形物が得られ、これを塩化メチレンに溶解し、メクノールで洗い、減圧下80℃で12時間乾燥した。4.76 gの生成物がおこれ、これは収率95.2%であった。製造はおこで12時間乾燥した。4.76 gの生成物がおおこの生成物はMn=181,500g/モルおよこの生成物はMn=181,500g/モルのポリー4ーtープトキシスチレンであった。この重合体のガラス転移はは103℃であった。

夹施例2

実施例1の手順を繰返したが、本例では16.

り制御して温度を60℃以下に保った。発熱がや んだ後、反応混合物を60℃に0.5時間、マグ ネシウムの大部分が消費されるまで加熱した。塩 - 氷浴を用いて反応混合物を0℃に冷却し、44 g(0.23モル)のt-ブチルパーベンソエー トを 8 0 叫のテトラヒドロフランに溶解した溶液 を温度を0℃-5℃の間に維持するような速度で 加えた。添加完了後、かきまぜながら 2 時間にわ たって温度を25℃まで上昇させた。次に反応混 合物を1000回の3%塩酸に注入した。生成し た油を200回のエチルエーテルで数回、水溶液 から抽出した。エーテル脳を10%水酸化ナトリ ウム水溶液で2回洗い、次いで水で、洗液が中件 になるまで洗った。次にエーテル層を硫酸ナトリ ウム上で乾燥し、回転エバポレータを用いてエー テルを除去した。残った黄白色の油に少量のアイ オノールを禁止剤として加え、生成物を分別器留 した。沸点が 4 5 - 4 6 C/0. 0 3 mm である 4 - t - ブトキシスチレンを収率20%で得た。ブ ロトンNMRスペクトルを記録した。これは生成

9 g (0. 70モル)のマグネシウム金属おび 100g (0. 66モル)のイークロローαーメチルスチレンを200回のテトラヒドロフランに 溶解して川いた。少量のヨウ化メチルを加え2時間 リニヤール反応を開始した。反応混合物を12時間 シンエートを300回のエチルエーテルに溶解した。4、4′ージイソプロペニルと 同定される 結晶生成物を流ってこした 没った。メタノールをストリッピと、水の近により4ーtーブトキシーαーメチルス チレンを、沸点65ー68℃/0.03mmの低色の 放体として収率69.3%で単載した。

4-t-ブトキシ-α-メチルスチレンのカチオン重合を、窒素穿明気中の密封条件下で、3.5gの4-t-ブトキシ-α-メチルスチレン、1 mlの1.2-ジクロロエタンおよび0.04gの4-メトキシジフェニルヨードニウム ヘキサフルオロホスフェートで行った。混合物を-28

でから-50でに冷却し、450フットのハノビア(Banovia)中圧水銀アークランプを用いて1時間照射した。照射後、精稠な重合体混合物を-30でで0.5時間静留し、次いでメタノール中で沈澱させた。重合体を沪過し、メタノールで洗い、次いで真空下で乾燥し、M。=10.173g/モルおよびM。=15.495g/モルのポリー4-プトキシーαーメチルスチレン0.8gを得た。

実施例3

実施例1をすべての点について繰返したが、本例では4-クロロスチレンの代りに3-プロモスチレンを用いた。3-t-プトキシスチレンである生成物を分別蒸留により精製し、沸点50-52で/0.05mの純粋な単量体を次の重合に用いた。0.36gの2,2′-アソビスイソブチロニトリルと15.0gの3-t-プトキシスチレンの混合物を窒素下で重合フラスコに密封した。重合を70℃で18時間行った。重合体を実施例1に記載した通りに単難した。

0.5 gのポリー4-t-ブトキシスチレン、
0.2 gのジ(4-t-ブチルフェニル)ョード
ニウム ヘキサフルオロアンチモネート、 0.0
037 gのペリレンおよび 5 miのグライムを含す
するホトレジスト溶液を製造した。この溶液を直
は4インチのシリコンウェーハにスピンコート
け00で30分間焼付けた。多重密度マスク付
きのパーキン・エルマー(Perkin Elner)111
投影アライナを用いてウェーハを誘光した。ローヘキサンとクロロホルムの3:1混合液を用いて、ウェーハをもガモードで現像した。走査速度32
0で最良の結果が得られた。1.5 μ g までのラインを解像し、2.5 μ g のラインで解像度段好であった。

上述した実施例は、ホトレジスト組成物をマスクするのに用い得る極めて多数の変数ならびにアルケニルアリールエーテルおよびそれから得られる重合体のごく一部に関するものであるが、本発明は、実施例に先立つ説明からわかるように、はるかに広い範囲のホトレジスト組成物ならびにこ

実施例 4

0.5 gのボリー4-t-ブトキシスチレン、
0.1 gのジ(t-ブチルフェニル) ヨードニウム トリフルオロメタンスルホネートおよび7 ml のグライムよりなる溶液を、数個の直径3 インチのシリコンウェーハにスピンコートした。次にウェーハを100℃で30分間焼付け、次に金属接点材およびGE H3TT中圧水銀アークランプを用いてプリントした。2秒間の照射後、100℃で5秒間の後焼付けを行った。ウェーハを1.6 N Na OHに1分間浸液することによりウェーハを現像した。鮮明な輪郭のはっきりしたポジイメージが得られた。

ポリー4ーtープトキシーαーメチルスチレンに基づくホトレジストを用いて、上記と同じ手順を繰返した。最初にシリコンウェーハを5秒間照射し、100℃で10秒間の後焼付けをし、1.6N NaOHで1分間現像することにより、ポジトーンのイメージが得られた。

実施例 5

の組成物の製造に用いるアルケニルアリールエー テル材料に関することを理解すべきである。

特許出願人

ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 化理人 (7630) 生 沼 徳 二